



ナノテクノロジープラットフォーム 産総研 微細構造解析プラットフォーム H30年度 第1回地域セミナー

■主催：国立研究開発法人 産業技術総合研究所 先端ナノ計測施設（ANCF）
■共催：文部科学省 ナノテクノロジープラットフォーム

先端計測分析技術で あなたの研究開発をサポートします！

日時

平成30年 **10月5日（金）**
13:30～17:00

参加無料
定員30名

場所

御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター
Room A (1F)

◆お問い合わせ・参加申し込み：国立研究開発法人 産業技術総合研究所 分析計測標準研究部門
ANCF問合せ窓口：ancf-info-ml@aist.go.jp

： 029-861-5300
(当日参加も可能です)



プログラム

13:30 開会

概要説明 分析計測標準研究部門 副研究部門長 斎藤 直昭

13:45 「陽電子プローブマイクロアナライザ装置」

分析計測標準研究部門 主任研究員 O'Rourke Brian

14:10 「超伝導蛍光吸収X線吸収微細構分析装置」

ナノエレクトロニクス研究部門 主任研究員 志岐 成友

14:35 「極端紫外光光電子分光装置」

ナノエレクトロニクス研究部門 担当研究員 松林 信行

15:00 「超伝導蛍光X線検出器付走査型電子顕微鏡」

ナノエレクトロニクス研究部門 研究員 藤井 剛

15:25 休憩

15:35 「可視-近赤外過度吸収分光計測装置」

分析計測標準研究部門 研究員 細貝 拓也

16:00 「リアル表面プローブ顕微鏡装置」

分析計測標準研究部門 主任研究員 井藤 浩志

16:25 「固体NMR装置」

物質計測標準研究部門 テクニカルスタッフ 林 繁信

16:50 閉会

sola city Conference Center

ソラシティカンファレンスセンター

アクセスマップ

東京都千代田区神田駿河台 4-6
御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター
Room A (1F)
電話 : 03-6206-4855

JR 中央線・総武線「御茶ノ水」駅
聖橋口から徒歩1分

東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅
B2出口【直結】

東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水」駅
出口1から徒歩4分

都営地下鉄新宿線「小川町」駅
B3出口から徒歩6分

御茶ノ水ソラシティ様HP<https://solacity.jp/cc/access/>より転載



◆お問い合わせ・参加申し込み：国立研究開発法人 産業技術総合研究所 分析計測標準研究部門
ANCF問合せ窓口： ancf-info-ml@aist.go.jp

： 029-861-5300

(当日参加も可能です)